

入門機器分析【1】 走査電子顕微鏡

【日時】 2018/4/18 (水) 13:00-17:00

【場所】 九州大学伊都キャンパス・工学部大講義室 (総合学習プラザ2F)

【主催】 九州大学中央分析センター

【共催】 九州大学ナノテクノロジープラットフォーム

【協力】 株式会社日立ハイテクノロジーズ

13:00-14:00 ようこそ走査電子顕微鏡の世界へ

SEM (Scanning Electron Microscope) をはじめて使用する方へSEMとはどういうものかを詳しく説明し、何ができるのかを装置構成を含め解説します。

14:00-15:00 走査電子顕微鏡を使う前に

SEM観察を行うにはどのような準備が必要であるかを説明し、前処理方法および前処理装置に関して紹介します。

15:15-16:05 走査電子顕微鏡ワンランク上の使い方

SEMを使用する際に発生するトラブルに対し、解決方法や観察テクニックについて解説します。

16:05-17:00 広がる走査電子顕微鏡の可能性

SEM は観察するだけでなく、各種分析装置と組み合わせると、その特性に応じた情報を取得できます。中央分析センターに既設のSEMの紹介と特徴、使い分けを説明します。併せて最新の応用技術の紹介を行い、SEMの可能性について言及します。

機器分析は、研究開発に必要不可欠な手段であり、その手段は多岐に渡ります。今年度のセミナーは比較的ポピュラーな機器分析に関して初心者が理解しやすい内容になっています。初回は、多様な分野の研究・開発に必須であり、中央分析センターでも利用者ニーズが高い走査電子顕微鏡です。学内外どなたでもご参加できます。事前の参加登録にご協力をお願いします。

【問合せ・申込先】

九州大学中央分析センター伊都分室 渡辺 TEL092-802-2857
watanabe.midori.452@m.kyushu-u.ac.jp